

Школа № 87

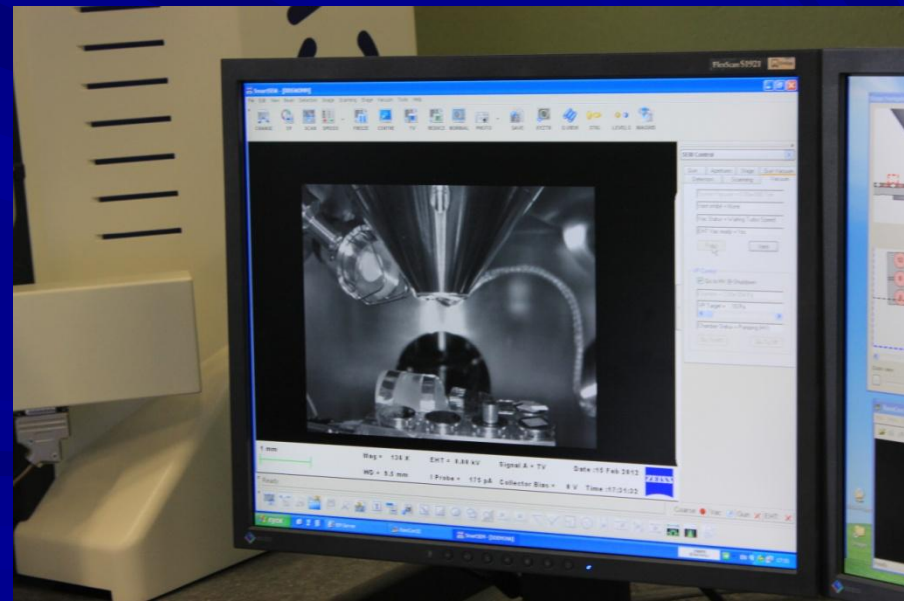
Кузьмина Ксения, Образцова Юлия

**Исследование
свойств шунгита**

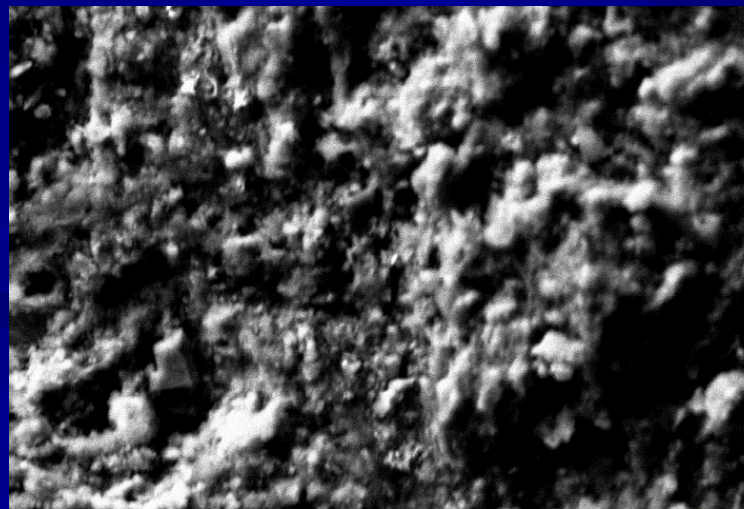
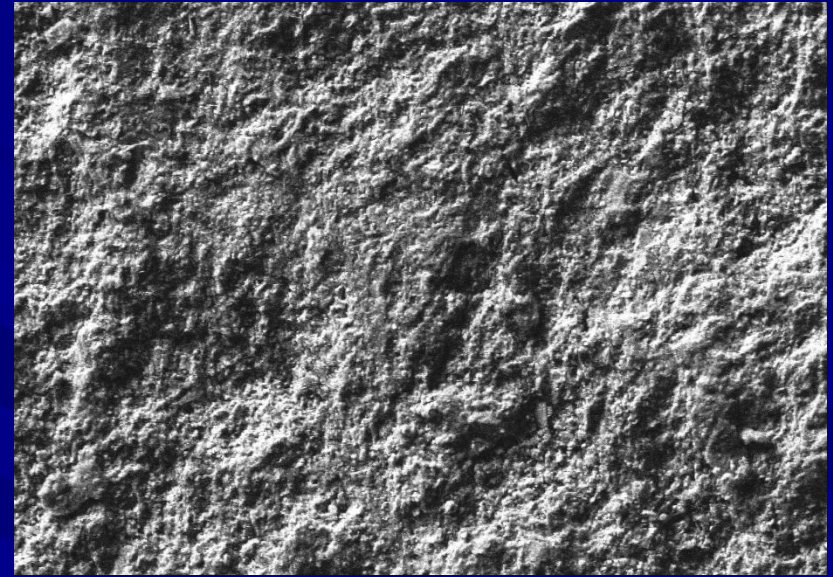
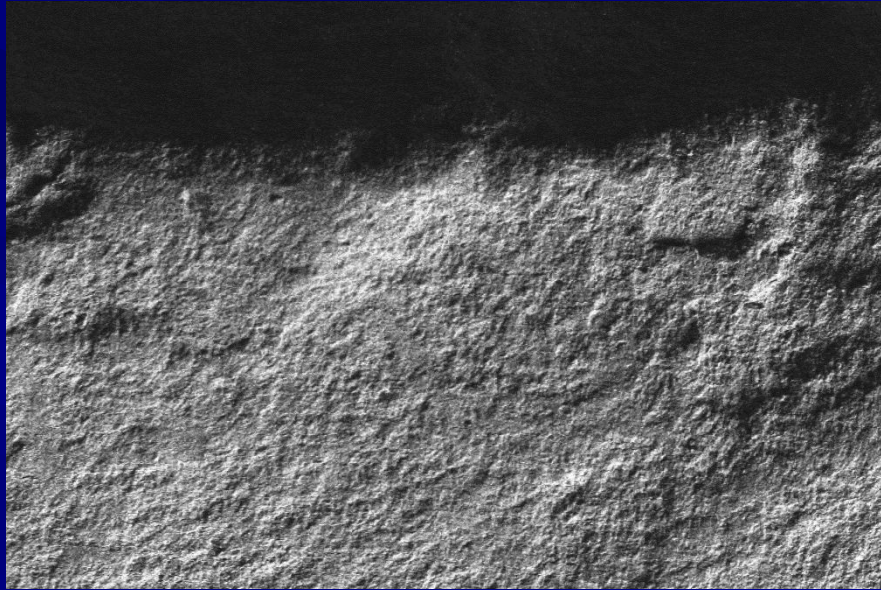
Методы исследования



Исследование проводилось с помощью электронного микроскопа на факультете физики в РГПУ им. А.И.Герцена

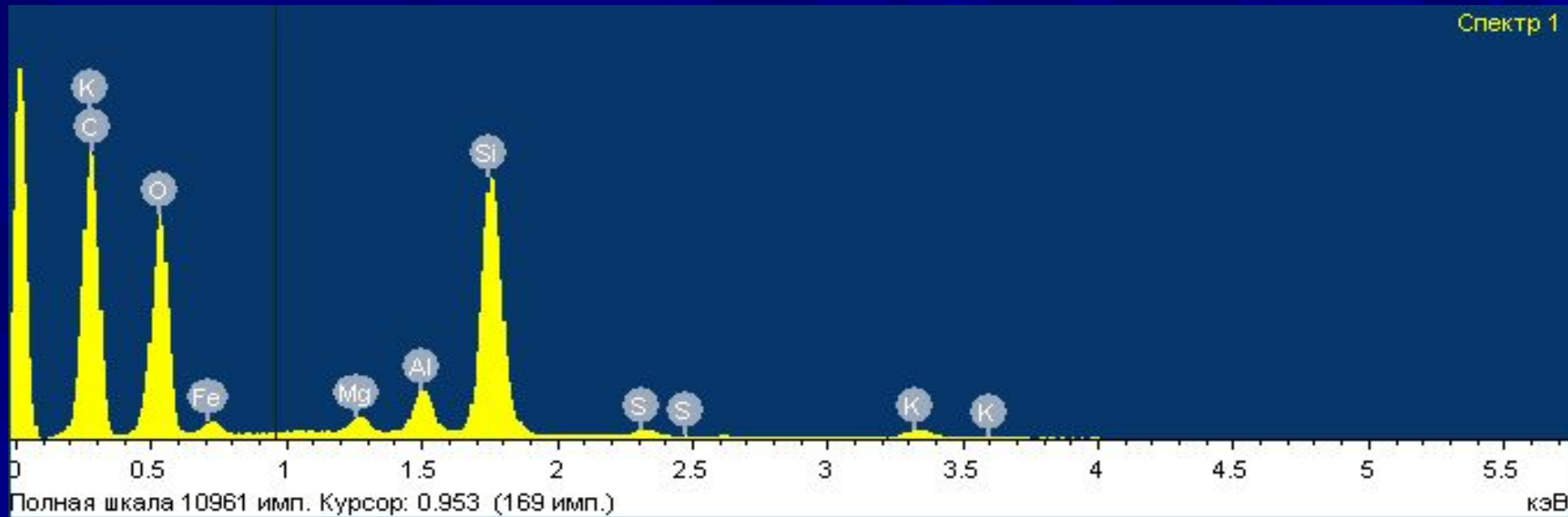


Изображения поверхности шунгита в электронном микроскопе



10 μm Mag = 15.33 K X EHT = 12.00 kV Signal A = SE1 Date :15 Feb 2012
WD = 10.5 mm I Probe = 175 pA Collector Bias = -250 V Time :18:32:28





Элемент	Усл. Конц.	Интенсивность Попр.	Весовой %	Весовой % Сигма	Атомный%
C K	31.62	0.7622	43.37	0.47	57.00
O K	30.35	1.0074	31.48	0.34	31.06
Mg K	0.70	1.0145	0.73	0.04	0.47
Al K	1.86	1.0252	1.89	0.05	1.11
Si K	13.13	1.0169	13.50	0.15	7.59
S K	0.44	0.9407	0.49	0.04	0.24
K K	0.96	1.0193	0.99	0.05	0.40
Fe L	3.29	0.4557	7.55	0.44	2.13
Итого			100.00		

Пиков не пропущено
 Параметры обработки : Все элементы
 (Нормализован)
 Количество итераций = 5
 Эталон :
 C CaCO₃ 1-июн-1999 12:00 AM
 O SiO₂ 1-июн-1999 12:00 AM
 Mg MgO 1-июн-1999 12:00 AM
 Al Al₂O₃ 1-июн-1999 12:00 AM
 Si SiO₂ 1-июн-1999 12:00 AM
 S FeS₂ 1-июн-1999 12:00 AM
 K MAD-10 Feldspar 1-июн-1999 12:00 AM
 Fe Fe 1-июн-1999 12:00 AM

Состав шунгита